U.D.C. 621.315.212

短尺同軸ケーブルの不均等性測定用パルス試験機

本多誠一* 堀口二三男**

Pulse Tester for Measurement of Irregularity of Short Coaxial Cables

By Seiichi Honda, D.S.E., Ibaraki University Fumio Horiguchi Hitachi Electric Wire Works, Hitachi, Ltd.

Abstract

Hitherto the irregularity of the coaxial cables for wide band transmission has been estimated in a statistical method. But following the development of TV transmission such estimation has come to require more exacting criteria to be employed. The testing by means of pulse, as described by the writers, seems to fulfill this requirement best. This pulse method is unique in providing a practical method of detecting such points in a cable where the irregularity of impedance has been caused. However, in its application in the shop test, where cables could be tested only in small length, the width of pulse needs to be reduced by some means like a wide band amplifier. However, wide band amplifier is so difficult to manufacture that the writers have devised a method which enables amplification of pulse of minute width, using low frequency amplifier.

The testing device which was trially designed and manufactured by the writers used the pulse of 0.04 μ s, and the frequency band of amplifier was 50c/s—50kc. These values would require the amplification up to about 25 Mc if wide band amplifier were used.

In addition to facilitating the observation of irregularity of impedance in short coaxial cable, the writers' tester has also proved much higher accuracy in its function as a fault locator, as compared with conventional devices.

[I] 緒 言

パルスを用いて目的物までの距離の測定を行うこと は,電波探知機,超音波探傷機などに早くから応用され ている。線路関係においては送電線の故障点標定に我国 でも数年前から用いられるようになつたが,最近は電力 ケーブルおよび通信ケーブルの事故点の検出にも利用さ れるようになつている。^{(1)~(4)}

* 茨城大学工学部 工博

ĥ.

k

** 日立製作所日立電線工場

テレビジョンや多重電話伝送用に使用する広帯域同軸 ケーブルは内部不均等性の小さいことが必要であるが, 従来この不均等性の評価は特性インピーダンス偏差の二 乗平均と相関亘長の積の形で表わされているが,この方 法は測定に時間を要し,しかもこの値が統計的量である ためこれよりケーブル内部の状態を判断することは相知 困難である。

しかしこの目的にパルスを利用すれば,ケーブル内部 不均等点からはその状態に応じたパルスの反射が起るか ら,ブラウン管オシロスコープ上にこの反射波形を観測

1702 昭和29年11月

評 1.

H

論

第36巻第11号

することができ,反射パルスのレベルおよび波形より不 均等点の大きさおよび状態も推定できるので従来の測定 法よりも実際的な方法といえる。しかもパルスによる障 害点の測定は四囲の状況によつて影響されることが少 く,たとえば送電線の場合,天候,地形などに支配され ない。さらにブラウン管上に直視できるので時間的にも 非常に短時間内に測定できる利点がある。しかし現在我 国で使用されているパルス試験機は長距離線路を対象と しているため亘長の短い線路については使用できない。

そこでパルス試験機を応用するときには、ケーブル製 造長内の事故点を検出することになるから従来のものよ り測定精度を向上させる必要がある。このためにはパル ス幅を狹くすること,パルス受信増幅器の帯域幅を広げ ることが必要となり測定器製作上に種々の困難が生じて くる。

今回われわれが試作したパルス試験機は、パルス半値 幅 0.04 µs のパルス幅の非常に狭いもので、米国および 英国で同軸ケーブルの不均等性観測に用いているものと 同程度のものであるが,反射パルスの受信増幅には広帯 域増幅器を用いないで低周波増幅器で増幅が可能な特殊 方式を採用し、十分パルス試験機としての成果をうるこ とができたのでその概要を報告する。



しパルスと同符号のパルス波形が表われ、障害点のイン ピーダンスが小さいときには送り出しパルスの符号と反 対の波形が表われる。これによつて障害点の状況までも 判断できるわけである。

実際の線路においては単なる線路の断線, 短絡故障以 外に線路内の各部において構造または絶縁物の汚損など による不均等がある。このような不均等もその不均等の 程度に応じてパルスの反射があるから, 受話増幅器の増 幅度を上げてやればブラウン管上にケーブル内部不均等 が見られるわけである。本報告に述べる装置はこのケー ブル内部不均等を観測するためのものである。

①Ⅱ〕測定法の原理

一般にパルス試験機は第1図に示すように、パルス送 信部,受信増幅部,ブラウン管装置の三部分より成立つ ている。パルス送信部より線路に送り出されたパルス電 圧は線路の減衰に応じて減衰しながら伝播していくが, 線路に障害点すなわち特性インピーダンスの変化点があ ると、(1)式で示すその点の電圧反射係数mで定まる大 きさと極性をもつたパルスの反射波が送端側にもどつて くる。

たゞし Zo: 線路の特性インピーダンス

Z': 反射点のインピーダンス

これを送端に接続した受信増幅器で増幅してブラウン 管上で見ればケーブルの状態に応じた波形がえられる。

線路上のパルスの伝播速度 v が既知であれば, 障害点 までの反射時間 t を測定すると障害点までの距離 l は

によつて求められる。

線路の障害が単純であればブラウン管上のパルス波形 も単純なものとなり、障害点のインピーダンスが線路の インピーダンスより高いときには第1図のように送り出

[III] パルス試験機製作上の問題

パルス試験機の製作上問題となるものにパルス幅とパ ルス受信増幅器の帯域幅とがあるので、以下これについ て考えてみる。

(1) パルス幅

一般にパルスの伝播速度 v は線路の実効誘電率 E で定 まり(3)式で与えられるような速度をもつている。

 $v = \frac{300}{\sqrt{\epsilon}}$ m/ μ s(3)

この速度をもつパルスが線路上を伝播していき、障害 点があると(1)式で示した反射係数mと線路の減衰量 に応じた高さの反射パルスが送端にもどつてくる。その パルスの極性は(1)式より知ることができる。これは障 害点が一箇所の場合であつて数多くある場合は反射パル スの波形も相当複雑なものとなる。

今第2図のように障害点が二箇所ある場合,たとえば Zoのインピーダンスをもつケーブルの途中に Z'のイン ピーダンスをもつケーブルを割込んだ場合を考える。パ ルス試験機のパルス幅を THS とし障害点間の距離 41 が $\frac{\tau v}{2}$ より大きい場合, $Z' > Z_0$ のときにはX点では送り 出しと同符号の反射波形が表われ, X' 点においては送 り出しと反対符号の波形が表われる。その模様は第2図 (1)のようになる。しかし 4l が $\frac{\tau v}{2}$ より小さくなると

短尺同軸ケーブルの不均等性測定用パルス試験機

 $(ii) \Delta l < \frac{\tau v}{2}$ $(ii) \Delta l < \frac{\tau v}{2}$ $\int -\frac{z_0}{l} \times z' \times z_0$ $\int \frac{z' > z_0}{l} + \frac{z_0}{l} + \frac{z_0}{l}$ $(i) \Delta l > \frac{\tau v}{2}$ $(2) \frac{z_0}{v}$ $\int \frac{z' > z_0}{l} + \frac{z_0}{2}$ $(1) \qquad (3)$

第2図 障害点2箇所の基本的反射波形 Fig.2. Basic Pulse Echo Responses of Cable with Two Fault Points

X および X' 点の反射波形は重なり合い, 第2図の(2) (3)のように点線の波形の合成としてブラウン管上には 実線のような波形が表われてくることになる。それ故障 害点が数多くありしかもその間の距離 41 が小さくなる と,反射波形も非常に複雑になりブラウン管上の波形か らケーブル内部の状態を解析することが困難になるか ら、ケーブル内部の不均等性を見るためにはパルス幅 で をできるだけ小さくすることが必要となつてくる。たと えば現在使用されているパルス試験機の最小パルス幅は 0.2 µs 程度であるが,このパルスで第2図(1)のような 単純な反射波形をうるためには、パルスの伝播速度を光 波の 50% とすれば障害点相互の距離 4l は 15 m 以上 であることが必要となる。そのためケーブル製造長内の 不均等性を観測するには0.2µsよりさらに幅の狭いパル スがぜひ必要である。このような微小幅のパルスになる とパルスの発生自体が相当困難になるので,測定機製作 上の障害になつてくる。



1.5 倍, 三角波では 1.6 倍, 矩形波では 10 倍が必要であるといわれている。

今回われわれが試作したパルス試験機について計算し てみると,繰返し周波数を100kc,パルスの半値幅を 0.04 µs,パルス波形をレーズドコサインに近いものとし て,パルス半値幅の逆数の1倍にとつて100kc~25 Mc の増幅が必要となつてくる。

このように増幅器の周波数帯域を広くとると,波形増 幅歪を少くするための平坦な周波数特性をうることもさ らに一段当りの増幅度を上げることも困難となつてくる し,特にブラウン管上に十分観測できるような増幅器出 力をうることがきわめて困難である。われわれもピーキ ングコイル増幅および負饋還増幅を用いた広帯域増幅器

1703

(2) パルスの受信増幅

不均等点よりの反射は(1)式の反射係数が通常小さい のでその反射波電圧はきわめて小さいものとなる。した がつて反射波をブラウン管上で見るためには,そのまゝ では見えないので増幅器で増幅する必要があるが,パル スの場合には正弦波のときと異りこの増幅器の周波数帯 域に問題がある。

一定の繰返し周波数を有するパルスはフーリエ級数を 用いて考えると,繰返し周波数を基本波とする高調波の 集合とみなすことができるから,パルスの波形を忠実に 増幅するためには増幅器の周波数特性を広帯域にする必 要が生じてくる。このパルス増幅器の帯域幅とパルス幅 との関係については種々の報告があるが、⁽⁵⁾⁽⁶⁾ Lebert, Maggio および Shott の研究結果によれば、増幅器の 所要最高周波数は**第3図**に示すようなレーズドコサイン 波形ではパルスの半値幅の逆数の 0.9 倍、半正弦波では の試作実験を行つたが、十分な効果をうることができなかつた。

〔IV〕 周波数帯域縮小式パルス増幅法

[III] に述べたように,短い線路の反射をこまかく観察するためにはパルス幅を狭くすることが必須の条件であるから,今回試作したパルス試験機では半値幅 0.04 µs のパルスを発生している。この微小幅のパルスを増幅するには繰返し周波数より最高約 25 Mc までの帯域の増幅が必要である。このような広帯域増幅が困難であることは前述の通りである。

この問題を解決するために,試作パルス試験機に使用 した増幅方法は 100 kc~25 Mc の帯域のパルス波形を 100 c/s~25 kc の帯域で同一波形を再現するもので,し たがつて周波数低降装置を必要とはするが,周波数低降 後の増幅器としては通常の低周波増幅器を用いて十分な 利得および出力をえることができるもので,この方法を 周波数帯域縮小方式と名付けた。

パルスを通信を目的とする PTM などに使用する場合 にはそのパルス波形は通信の内容に応じて時々刻々に変 化するが,われわれの当面の研究の目的としているパル スによる線路の反射の観察においては相当の時間の間は 同一波形を繰返している。このような同一波形の繰返し は一例として前に述べたように繰返し周波数を 100 kc とする 100 kc~25 Mc の帯域でなくても,繰返し周波

評 H M.

第36巻第11号



周波数帯域縮小の 原理 第4図 Fig. 4. Principle of Frequency Band Width Construction of Amplifiers

数を 100 c/s とする 100 c/s~25 kc であつても全く同 じ波形が再現できなければならない。

この周波数帯域を縮小する方法としては、たとえばパ ルス発生器の繰返し周波数が 100 kc の場合には 100.1 kc または 99.9 kc の別のパルス発生器を設けてこれに よつて被観測信号を変調し、その低周波成分 100 c/s~ 25 kc の帯域を取出して増幅すればよい。

この帯域縮小の模様を図示すれば第4図のようにな る。すなわち第4図(A)のようなパルス電圧に(B)のよ

入れればその出力電流 im は

論

$$i_m \propto \left\{\sum_{n=0}^{\infty} An \cos n \,\omega_0 \,t + \sum_{n=0}^{\infty} Bn \cos n \,\omega_1 \,t\right\}^2 \dots \dots (6)$$

となる。この出力電流 im の中の直流分は除外し、また その低周波成分すなわち $\omega_1 > \omega_0$ として $\omega < \omega_0/2$ の範囲 のみを取出すことゝすれば

$$i_{m} \propto \frac{1}{2} \sum_{n=1}^{M} AnBn \cos n \left(\omega_{1} - \omega_{0} \right) t \dots \dots \dots (7)$$

となる。たゞし Mは $n(\omega_1 - \omega_0) < \omega_0/2$ の範囲内の nの 最大値である。(5)式において波形を矩形波とし、パル ス幅を $\tau \mu s$,繰返し時間を $T_0 \mu s$,振幅を Bとすれば

$$B_{0} = \frac{\tau}{T_{0}} B$$
$$B_{n} = \frac{2 B}{\pi} \cdot \frac{\sin n\pi \frac{\tau}{T_{0}}}{n}$$
(8)
となる。こゝで $n \frac{\tau}{T_{0}} \ll 1$ の範囲では
 $B_{n} = \frac{2B\tau}{T_{0}}$(9)

うに繰返し周波数が(A)より 10% 高いパルス電圧を重 ねると(C)のような電圧となるから、この(C)の波形の 低周波成分のみを取出せば(A)の波形を 10 倍に引伸ば したものがえられる。(A)の波形を忠実に再現するため には(B)のパルスはパルス幅の狭いことが望ましい。ま た低周波のパルスをうるためには(A)と(B)を重畳して クリップしたのみでもあるいは変調してもよい。

この関係をフーリエ級数を用いて解析すればつぎのよ うになる。すなわち一般にパルス波形の電圧を e1 とす れば

にて示される。こゝで ω₀ は繰返し角周波数である。パ ルス波形を忠実に再現するためにはn=∞すなわち無限 に高調波を再生しなければならないが、実際問題として はパルスの波形はあまり厳密を要しない場合が多く,こ の場合にはおおよそ $N = T_0/\tau$ 程度まで再現すれば十分 である。すなわち繰返し周波数 100 kc ($T_0 = 10 \ \mu s$), τ =0.04 µs ならば N=250 となり最高周波数は 25 Mc と なる。

(4)式のパルス電圧 e1 と繰返し角周波数が少しく異 る ω1 のパルス電圧 е2 は

で示されるが、 e1 と e2 を重畳して二乗特性の変調器に

ので

となり、(10)式の Σ 内の形は基本角周波数が $\omega_1 - \omega_0$ と なり n の最大値が M となつたのみで他は(4)式の波形 と全く同じである。したがつて Mが Nの値より大であ れば(10)式は実用上(4)式と同じ波形を再現するとみて 差支えない。

一例として $\omega_0 = 2\pi \times 100 \text{ kc}$, $\tau = 0.04 \mu \text{s}$, $\omega_1 = 2\pi \times 100 \text{ kc}$ 99.9 kc とすれば、(10) 式の繰返し周波数は 100c/s と なり, また N=250 で十分であるのに対して M=500 ま で採りうることになる。いま第250高調波までを採るこ とにすれば、(10)式による周波数帯域は 100 c/s~25 kc となり(4)式をそのまゝ実用上再現するための周波数帯 域 100 kc~25 Mc に比べて帯域幅が 1/1,000 に縮小す ることが判る。

この主パルス発生器と局部パルス発生器の繰返し周波 数を異にする方式は,繰返し周波数の安定度が十分でな いと差周波数の変動が甚だしく波形の観測が困難になる ので,今回の試作試験機は主パルスおよび局部パルスの 繰返し周波数を同一にし、50c/s で局部パルス(こゝで は走査パルスと呼んだ方がよいので以下走査パルスと呼 ぶ)を位相変調する方法によつた。

この方法でも前に述べた原理にしたがつて周波数帯域 の縮小変換が行われる。この説明は省略するが、周波数



短尺同軸ケーブルの不均等性測定用パルス試験機

帯域縮小変換後の増幅器に所要周波数帯域幅は 0.04 µs のパルスに対しておおよそ 50 c/s~25 kc まで増幅すれ ばよい。おおこの方式では走査パルスの位相変調角を小 さくすると帯域幅を縮小できる特長をもつている。

〔V〕 試作パルス試験機の回路構成

今回試作したパルス試験機は走査パルスを位相変調す る方式を採用しており,その回路構成は**第5図**に示すよ うである。本装置においてはブラウン管横軸に 商用 50 c/s を与えているのでこれが走査パルスを位相変調する 50 c/s の位相と同位相であることが必要であるが,実際 にはこの間に若干の位相のずれがあるためにブラウン管 上には二重像ができる。これを防止するために 50 c/s で輝度変調を行いその半周期は消えるようにしている。 回路各部の詳細はつぎに記すようである。

(1) 主パルス発生器

主パルス発生器は**第6図**に示すようである。パルスの 発生には種々の方法があるが⁽⁷⁾本装置においてはブロッ キング・オシレータによる方法を用いている。**第6図**で $V_2(6J6)$ の回路が主ブロッキング・オシレータであつて, 増幅陽極回路のインダクタンス L_1 を取除けばほゞ 0.06 μ s 程度のパルスが発生する。ブロッキング・オシレータ 用のトランス T_2 はそのインダクタンスが小さいために その同期がきめて困難であるので、 $V_1(6J6)$ の 0.2 μ s 幅 のブロッキング・オシレータを別に設けこれを V_2 の同 期用に使用している。このようにすると同期はきわて容 易となり V_2 の格子抵抗の広範囲にわたつて同期はくず れない。



1705

第5図 試作パルス試験機の回路構成 Fig.5. Block Diagram of the Pulse Tester

ルスをクリップ整形したのちに終段増幅管 50L6GT に 加えている。各部における波形は**第6図**に示す通りで, パルス出力としては正負のパルスがえられるようになつ ている。なおパルス出力端子のコンデンサは波形を整え るためのものである。

(2) 移相回路および位相変調回路

移相回路および位相変調回路は**第7図**(次頁参照)に示 すようである。主パルス発生器同期用の 100 kc 正弦波 発振器(6SN7)の発振コイルに二次巻線を施し,その出 力電圧を手動移相回路を通したのちに 6AK5 および $\frac{1}{2}$ 12AU7 で増幅する。 $\frac{1}{2}$ 12 AU7の陽極回路でこの100 kc の電圧と商用 50 c/s の電圧が加えられてクリッパー管 $\frac{1}{2}$ 12AU7 に入る。商用 50 c/s の電圧に応じて 100 kc の電圧のクリップされる位相位置が変化されるので、ク リッパー管の出力微分波形で走査パルスを同期させれば 走査パルスは 50 c/s で位相変調を受けることになる。

 $V_3(6V6)$ は微分増幅回路であるが、この 6V6による増幅回路はかならずしも必要でなく、これを用いない場合は終段出力電圧が約2/3に減少する程度である。これを $V_4(6J6)$ によるカソード・フロア回路に入れてパ

走査パルスは主パルスと同様に 6J6 のブロッキング・ オシレータによつて電圧約 60 V,半値幅 0.03 µs のもの を用いている。この走査パルスの幅は厳密には観測パル スの幅に比べて十分狭いことが必要であるが,発生が困 難となるのでこの幅のものを用いた。実験によれば,



第6図

主パルス発生器回路図

Fig.6.

Main Pulse Generator Circuit Diagram

1706 昭和29年11月

評 M.

論

H

第36巻第11号





第8図 変調器および低周波増

幅器

Fig.8.

Modulator and Low

Frequency Amplifier Circuit Diagram

0.04 µs 幅のパルスの観測にはこの程度のパルス幅でも さほど支障はないようである。

(3) 変調器および低周波増幅器

変調器は第8図のようである。すなわち真空管212A T7 は静的には十分高いカソード・バイアスが与えられ ていて陽極電流は流れない。走査パルス発生器よりの負 パルスが与えられるとカソードが負になつて陽極電流が 流れる。信号入力はグリッドに与えられる。

低域濾波器としては遮断周波数約 60 kc,影像抵抗 500 Ωの5段の定K型を使用し、低周波増幅器としては 6AK5の2段増幅を行つている。この総合特性はブラウ ン管オシロスコープ内の増幅器を含めて利得約70dbで ある。

試作パルス試験機による観測例 $[\mathbf{VI}]$

試作試験機によつて同軸ケーブルの内部不均等性を観 測した例について述べる。

第9図に示した写真はポリエチレン充実型同軸ケーブ ル 50 m について観測した場合のものである。主パルス

発生器の出力は平衡出力であるから不均等性の測定には 平衡回路を使用して送り出しパルスを消す必要がある。 第9図の(A)は平衡回路を用いないで受電端開放の同軸 ケーブルに与えたパルスをそのまムブラウン管上で観察 したもので、下方に出ているのが走査用パルス位相変調 を行わないものである。(B)は(A)の走査パルスに位相 変調を行つた場合の直接波形である。

(C)は平衡回路を使用しないで受電端開放の同軸ケー ブルに与えた波形をパルス増幅器を通して観察したもの で、パルス増幅器の増幅度は約10db程度である。(D) は平衡回路を用いて送り出しパルスを平衡させ、同軸ケ ーブルの終端に 75Ω の純抵抗を接続したときの不均等 波形である。この写真の増幅度は約40dbである。送り 出しパルスは完全に平衡がとれないため相当大きい波形 になつている。なお 75Ω 終端抵抗の反射パルス波形は Cheetham, Mather および Shott が行つた試験⁽⁸⁾の パルス波形と全く同じである。(C)の送り出しと反射パ ルスとの間にも(D)と同じ不均等波形がえられるわけで あるが、 増幅度を上げると 増幅器が 飽和するから(D)の



短尺同軸ケーブルの不均等性測定用パルス試験機 1707



Fig.9. Pulse-Trace Photographs Obtained from the Pulse Tester

ように送り出しと終端反射を平衡させて消してやることが必要である。

(E)は(D)の終端に接続した抵抗を 85Ω にした場合

ら,この方法は同軸ケーブルの性能試験および品質管理 に大いに貢献できると考える。

なお本試験機はケーブル内部不均等性ばかりでなく, 断線,短絡などの事故点の検出に使用できるのは勿論で, その精度も非常にすぐれている。

で、終端の反射が明瞭に表われている。しかしケーブル 内部の不均等波形には変化はない。このパルス波形より 測定ケーブル内には相当大きい不均等のあることがわか る。また測定ケーブルの平均インピーダンスと終端抵抗 の値より、ケーブル内部各点のインピーダンス偏倚 S_x も、さらに図式計算によつて従来ケーブル内部不均等性 の表現に用いられていた不均等量 $\overline{s^2} \cdot r$ も計算できる。 これらについては改めて報告する予定である。

(F)は供試ケーブルの代りに 75Ω の純抵抗を接続し た場合の波形でこの場合でている凹凸は雑音および不平 衡分などである。

従来使用されている不均等性測定法では⁽⁹⁾⁽¹⁰⁾, 少くと も測定に1時間以上を要したのがパルス試験機では数分 で観測ができ,しかも実測写真よりわかるように内部の 状態まで判断できることは非常に便利である。

〔VII〕 結 言

以上今回試作したパルス試験機の概要を報告したが, 同軸ケーブルの内部不均等性測定にパルスを応用するこ とは,直視できる点,ケーブル内部の状態の推定できる 点,さらに短時間で測定できる点など従来の測定器とは 比較にならないほどの利点がある。しかも短距離線路の 観測に必要な微小パルス幅試験機においても従来のよう な広帯域増幅器の必要がなく,今回の装置に応用した周 波数帯域縮小方法を用いれば装置の製作も容易であるか 終りに本研究に関して終始御指導,御鞭撻を賜つた日 立製作所日立電線工場斎藤工場長,内藤技術部長,久本 試作課長および茨城大学安宅教授に深く感謝の意を表す る。

参考文献

- (1) 古賀,飯島: 電気学会誌 72 258~263 (昭 27.5)
- (2) E. Rarguley: Electrical Communication 30186~216 (1953. 9)
- (3) A.W. Lebert: B.L.R. 29 153 (1951. 4)
- (4) E. Baguley, F.B. Cape: Post Office Elect.Eng. Jour. 44 164~168 (1952. 1)
- (5) 今井: 通信工学を理解するための数学 電気通信学会(昭 27.8)
- (6) A. W. Lebert, J. B. Maggio, J. T. Shott:
 A.I.E.E. Technical Paper 47~86 (1946. 12)
- (7) 森元,山口,黒岩: テレビジョン工学 コロナ社 (昭 28.4)
- (8) R. J. Cheetham, E. L. Mather, W. W. H.
 Clarke: P. I. E. E. 101, Part IV 135~144 (1954. 2)
- (9) 木野, 斎藤: 第21回連合大会予稿 (昭17.10)
- (10) 本多, 堀口, 瀨成田: 日立評論 35 983~991
 (昭 28.11)

『日立評論』 電線ケーブル特集号 別冊 No. 9

最近の電線,ケーブルおよび伸銅品は,製品分野の拡張と性能の向上に実に目覚しい発達を遂げている。 すなわち,高電圧送電という時代の要請に即応して,ケーブルに送電線に飛躍的技術の向上が行われた。 また一方においてはテレビ関係を始めとする高周波搬送通信の普及によりこれに必要なケーブルの製作がな された。絶縁関係においても電力,通信を始め各分野にわたつてますます合成樹脂および合成ゴムが応用さ れ,性能のすぐれた各種新製品が製造されている。

日立製作所においてはこれに伴い鋭意設備の拡充,改善,真剣なる技術の研鑽,社内各工場および研究所 との協力と相まつて各種製品の性能向上を図り,いずれも嘖々たる名声を博している。

今回日立製作所日立電線工場を始め関係研究所の精鋭を動員し、その技術の粋を集めて本文140頁,写真 図版 500 版近くの大集成別冊 No. 9「電線ケーブル特集号」として明春1月末発行の予定で着々編集中であ ります。何卒その発行を御期待下さい。

◎ 内	容	\Diamond										
言	.通]	韵 産	業	省	鉱	Щ	局	長	Л	上	為	治
説	.通商	産業	省鉱	Щ	局会	金盾	属課	長	中	Щ		章.
アルミ被ケーブル	.日立	製作	听・	日:	立	官紡	ίŢ	場	{据 【鈴	口二司木	二三 一 敏	男男雄
&搬送水底ケーブル	.日立	製作	沂•	日二	立	 信 続	{工	場	{庄 八 佐	司田藤	一伸	男達雄
	◎内 言 説 ドルミ被ケーブル と搬送水底ケーブル	☑ 内 容 言通問説	 図内 容 図 言通商産 説	 図内 容 図 言通商産業 説	◎内 容 ◎ 言通商産業省 説	図内 容 図 言通商産業省鉱 説	○内 容 ○ 言通商産業省鉱山 説通商産業省鉱山局金属 アルミ被ケーブル日立製作所・日立電線 *搬送水底ケーブル日立製作所・日立電線	○内 容 ○ 言通商産業省鉱山局 説	 ○内 容 ○ 言通商産業省鉱山局長 説	 ○内容○ 言通商産業省鉱山局長川 説	 図内容図 言通商産業省鉱山局長川上 説通商産業省鉱山局金属課長中山 アルミ被ケーブル日立製作所・日立電線工場 (掘口) (堀口) (上) (上) (上) (二) <li< td=""><td> 図内容② 言通商産業省鉱山局長川上為 説</td></li<>	 図内容② 言通商産業省鉱山局長川上為 説

◎電力ケーブルの真空乾燥における理論的考察日立製作所 {中央研究所 河 1 日立電線工場 {間 工	合 鱗 次 郎 瀬 喜 好 藤 大 二
◎ 0 F ケーブル用絶縁油の特性日立製作所 日立研究所 高	橋 治 男
◎分割導体ケーブルの実効抵抗日立製作所・日立研究所加	子 泰 彦
◎発電所主幹ケーブルの配列における諸問題日立製作所・日立電線工場 橋	本 博 治
◎ビニル混和物中の可塑剤の拡散速度日立製作所・日立電線工場 吉	川 充 雄
◎電線用プラスチック材料の耐候性日立製作所・日立電線工場 {川 ヌ 吉	和田七郎川充雄
◎合成ゴムの高電圧ケーブルへの応用日立製作所・日立電線工場 (渡 吉	辺 茂 隆 川 充 雄 司 博
◎エナメル線塗装上の基礎的考察日立製作所・日立電線工場 {間 ──液の接触角と表面張力──	瀬 喜 好 崎 公 男
◎ホルマール線の諸問題日立製作所・日立電線工場 {間 (欠)	瀬 喜 好尻 義田 孝
◎珪素樹脂のマグネットワイヤーへの応用日立製作所・日立電線工場 {間 荻	瀬 喜 好野 幸 夫
◎240 mm ² ACSR (鋼心アルミ撚線)の低温特性日立製作所・日立電線工場 {山 福	本 三 郎 田 重 穂
◎導電材料としての銀入銅とその応用日立製作所 {日立電線工場 栗飯	本暢夫塚富雄
◎トロリ線の間歇負荷による温度上昇と 機械的特性の変化	本 方 本 博 治
◎銅線の精製引抜条件に関する考察日立製作所・日立電線工場 {柿	崎 公 男本 方
東京都千代田区丸の内1/4 日 立 評 論 社 誌代特集号1冊 (新丸の内ビルディング7階) 日 立 評 論 社 (振替口座東京	¥100 〒 16 (71824 番)